Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

УДК 539.216.2-026.5

## АННАМАМЕДОВ Шатлык Союнмаммедович

# ЭКРАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИТОВ КРИСТАЛЛОВ In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>

Автореферат на соискание степени магистра по специальности 1-98 80 01

> Научный руководитель д-р хим. наук, профессор Боднарь Иван Васильевич

Минск 2018

#### введение

Бинарное соединение  $In_2S_3$  образуется на разрезе In - S и относятся к дефектным полупроводникам с концентрацией вакансий в катионной подрешетке ~ 33 %. Указанное соединение обладает *n*-типом проводимости, высокой радиационной стойкостью и не испытывают влияния со стороны посторонних атомов, т.е. примеси являются электрически неактивными. Известны четыре структурные модификации указанного соединения. При комнатной температуре стабильна тетрагональная модификация (тип шпинели), остальные три модификации высокотемпературные и при обычных условиях не стабильные [1, 2].

Интерес к монокристаллам In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> вызван тем, что ширина запрещенной зоны этого соединения составляет  $E_g = 1,9 - 2,2$  эВ и оно перспективно для разработки преобразователей солнечного излучения, а коэффициент оптического поглощения, в пределах спектрального диапазона солнечного излучения, достигает значений ( $\alpha > 10^4$  см<sup>-1</sup>), что обеспечивает высокую поглощающую способность падающего излучения в тонких пленках [3,4], а также возможность заменить токсичный CdS на In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> при производстве преобразователей свойств солнечного излучения. Сочетание этих данного обусловливает перспективность соединения при реализации разнообразных устройств: линейнотехнических светодиодов поляризованного излучения, дисплеев [5], электрооптических модуляторов, фотопреобразователей солнечного излучения с высоким КПД (~12-18%) [6 - 11].

Соединение FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> относится к полупроводниковым соединениям типа типа  $MB^{III}_{2}C^{VI}_{4}$  (M – Mn, Fe, Co, Ni;  $B^{III}$  – Al, Ga, In;  $C^{VI}$  – S, Se, Te) [4-6] и является перспективным материалом для создания на его основе лазеров, модуляторов света, поверхностно-барьерных структур и других функциональных устройств, управляемых магнитным полем [12 – 14].

#### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

#### Связь работы с крупными научными программами, темами

Тема работы соответствует перечню приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1196 от 12 августа 2010 г., в частности, разделу 2 «Супрамолекулярная химия, химический синтез новых веществ и заданной структурой, материалов с функциональными И физикохимическими свойствами.

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является – разработка температурных режимов выращивания монокристаллов соединений  $In_2S_3$  и FeIn\_2S\_4, определение их состава, кристаллической структуры, параметров элементарной ячейки, а также создание элементов экранов ЭМИ и исследование их свойства.

Для выполнения поставленной цели в работе были сформулированы следующие задачи:

– разработать оптимальные режимы синтеза и выращивания монокристаллов соединений In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>;

– определить их состав, структуру, параметры элементарной ячейки;

 – создать элементы экранов ЭМИ и исследовать их частотные характеристики;

**Объектом исследования** являются монокристаллы  $In_2S_3$  и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>, выращенные методом Бриджмена (вертикальный вариант).

#### Личный вклад заявителя

Результаты исследований получены автором самостоятельно. Научный руководитель принимал участие в определении целей и задач исследования, интерпретации промежуточных результатов.

#### Положения, выносимые на защиту

1. Экспериментально обоснованные температурные режимы синтеза и выращивания монокристаллов  $In_2S_3$  и FeIn\_2S<sub>4</sub>, двухтемпературным методом и методом Бриджмена (температура расплава 1390–1420 К, кристаллизация расплава со скоростью ~ 2 К/ч), которые позволили получить оптически однородные монокристаллы указанных соединений и твердых растворов диаметром ~ 16 мм и длиной ~ 45 мм.

2. Экспериментально установленные: состав, структура и параметры элементарной ячейки.

3. На основе порошков тройных соединений FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>, созданы элементы экранов электромагнитного излучения для диапазона частот 8–12 ГГц до 12 дБ, что указывает на возможность использования полученных материалов в качестве экранов электромагнитного излучения радиочастотного диапазона.

Структура и объем работы. Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка и приложений. Общий объем диссертации – 44 страниц. Работа содержит 12 таблиц, 17 рисунков. Библиографический список включает 59 наименований.

### ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении рассмотрено определены основные направления исследований, обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и задачи работы.

В первой главе проведен литературный анализ кристаллической структуры соединений In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

Известны четыре структурные модификации соединения  $In_2S_3$ . В работе [15] структура  $In_2S_3$  интерпретировалась на основе кубической ячейки: гранецентрированная ниже 573 К ( $\alpha$ ) и типа шпинели – выше 573 К ( $\beta$ ). Позднее, в работе [16] на порошкограммах  $\beta$ – $In_2S_3$  было получено много сверх-структурных линий, которые не могли быть проиндицированы на основе кубической структуры типа шпинели. В результате была выбрана тетрагональная объемноцентрированная решетка, содержащая 16 формульных единиц  $In_2S_3$ . Она получается наложением трех кубических ячеек шпинели (c/a=3) так, что

$$a = a_{\kappa \nu \delta}/2 = 7.62$$
 Å и  $c = 3a_{\kappa \nu \delta} = 32,32$  Å

а<sub>куб</sub> – период решетки кубической структуры шпинели.

1) тетрагональная объемноцентрированная сверхструктура  $\beta$ –In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> на базе шпинели стабильна до температуры 693 К, с параметрами: a = 7,61 Å, c = 32,32 Å пространственная симметрия *I*4<sub>1</sub>22;

2) кубическая структура  $\alpha$ –In<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, стабильна при температурах выше 723 К, кристаллизуется в структуре шпинели с параметром a = 10,77 Å, пространственная симметрия *Fd3m*;

3) тригональная структура  $\gamma$ -In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (по другим данным или разупорядочение катионов в октаэдрических пустотах, или гексагональная структура), температура превращения 1027 К, кристаллизуется в структуру с параметрами a = 3,8 ± 0,001 Å, c = 9,044 ± 0,005 Å [1] или a =3,85 ±0,01 Å, c = 9,15 ± 0,05 Å [25]. Данная структура нестабильна, поэтому для стабилизации используют легирование элементами V группы [1];

4) кубическая структура  $\delta$ –In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> образуется при температурах выше 1100 К при избытке индия с периодом решетки а = 5.36 Å [26, 27]. Больше сведений по данной высокотемпературной модификации найдено не было.

Экспериментальные значения ширины запрещенной зоны соединения  $In_2S_3$  колеблются от 2,2 до 2,639 эВ для прямых переходов и от 1,4 до 2,24 эВ – для непрямых [43, 44]. Кристаллы  $In_2S_3$  прозрачны в области длин волн с энергией больше 1,4 эВ. Значение ширины запрещенной зоны, полученное экстраполяцией зависимости ( $\alpha$ ·hv)<sup>2</sup> к оси hv, составляет 2,54 эВ для прямых переходов и 1,4 эВ для непрямых.

Соединение  $In_2S_3$  кристаллизуется в структуру типа шпинели. Полный анализ симметрии данной структуры с помощью теории групп был проведен в работах [45 – 48]. В кристаллический решетки  $In_2S_3$  имеет место большое количество стехиометрических вакансий, что приводит к нарушению периодичности решетки и, вследствие чего сильно искажается потенциальное поле кристалла, что сказывается на электрических свойствах. Кроме того, для соединения  $In_2S_3$  характерна неэффективность вводимых примесей для изменения их электрических свойств [49].

Соединение  $In_2S_3$  характеризуются низкими значениями подвижности носителей тока и электропроводности. В соединении  $In_2S_3$  в зависимости от степени отклонения от стехиометрии, концентрация носителей тока меняется на несколько порядков [50].

Тройное соединение  $FeIn_2S_4$  относится группе магнитных полупроводников. Указанное соединение  $FeIn_2S_4$  проявляет парамагнитные свойства во всем интервале температур исследования (4,2 – 298 K) и подчиняется закону Кюри-Вейсса (рисунок 1.21). Значение константы Вейсса для  $FeIn_2S_4$  -76 K, что указывает на то, что здесь имеет место антиферромагнитные взаимодействия [51].



Рисунок 1.21 - Зависимость относительной магнитной чувствительности от температуры для соединения FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>

Результаты магнитных измерений [49] показали, что кристаллы FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> являются парамагнетиками вплоть до ~ 12 К. Удельный магнитный момент монотонно возрастает с уменьшением температуры. Во внешнем магнитном поле 10 кЭ температура магнитного упорядочения ( $T_{mo}$ ) составляет ~ 16.8 К. С увеличением поля до 50 кЭ температура магнитного упорядочения  $T_{mo}$ смещается в сторону высоких температур и достигает ~ 21.5 К. Установлено отсутствие различий при измерении FC-кривых в прямом и обратном направлении изменения температуры, что наблюдается при классических магнитных переходах II-рода. В области 12 К наблюдается уменьшение удельного магнитного момента с уменьшением температуры. Этот факт указывает на наличие еще одного магнитного фазового перехода. Такое поведение характерно для антиферромагнитного состояния [49]. Температура этого перехода составляет ~ 12.5 К в поле 10 кЭ и уменьшается до ~ 11.9 К в поле 50 кЭ.

Исследованием эффекта Холла установлено, что кристаллы  $FeIn_2S_4$  обладают *p* типом проводимости. На рисунке 1.22 показана температурная зависимость концентрации и холловская подвижность носителей тока, определенные из измерений эффекта Холла для кристаллов  $FeIn_2S_4$ .



Рисунок 1.22 – Температурная зависимость холловской подвижности (кривая 1) и концентрации (кривая 2) носителей тока для кристаллов FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>

Видно, что подвижность носителей тока (кривая 1), начиная с температуры 300 К уменьшается, а в интервале 340÷390 К остается постоянной (~ 20 см<sup>2</sup>/В·с ). Далее, начиная с температуры 390 К подвижность тока растет и затем после температуры 430 К остается почти постоянной и равной  $\mu \approx 30$  см<sup>2</sup>/В·с. Концентрация носителей тока (кривая 2) в исследуемых температурных интервалах остается почти постоянной и равной  $P\approx (1\div3)\cdot10^{17}$  см<sup>-3</sup> [50].

По исследованию температурных зависимостей удельного электросопротивления FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> [51] показано, что образец демонстрирует активационный электрического сопротивления, которое характер возрастает уменьшением температуры. Удельное непрерывно с сопротивления для образца  $FeIn_2S_4$  составляет  $6{\times}10^2$  Ом ${\times}cm,$  при чем с понижением температуры наблюдается значительное увеличение удельного электросопротивления на 6 порядков.

В работе [52] показано, что монокристаллы FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> обладают значительным поглощением ( $\alpha > 10^3 \text{ см}^{-1}$ ). В области энергий 0,70 – 1,05 эВ коэффициент поглощения увеличивается, достигая максимума, а затем он с ростом ћ $\omega$  несколько уменьшается, достигая минимума при ћ $\omega \approx 1.2$  эВ. В области энергий ћ $\omega > 1,2$  эВ начинается резкий рост коэффициента поглощения с ћ $\omega$ . Предположительно, рост  $\alpha$  с увеличением ћ $\omega$  в области

энергий 0,70 - 1,05 эВ связан с началом межзонных переходов в этом соединении. Резкое увеличение  $\alpha$  в области энергий 1,2 - 1,6 эВ указывает на то, что край собственного поглощения в кристаллах соединения FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> обусловлен прямыми межзонными переходами. Значения ширины запрещенной зоны для кристаллов FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> равны *Eg* = 1,377, 1,450 и 1,460 эВ при температурах 300, 80 и 20К соответственно.

Во второй главе изложены экспериментальные методы получения объемных кристаллов и пленок. Описаны двухтемпературный метод (горизонтальный вариант) синтезированы поликристаллические слитки соединений  $In_2S_3$  и FeIn\_2S\_4. Разработаны температурные режимы выращивания монокристаллов направленной кристаллизацией расплава, (вертикальный вариант метода Бриджмена), позволяющие получать однородные монокристаллы соединений диаметром ~ 16 и длиной ~ 40 мм.

Для определения состава и кристаллической структуры выращенных монокристаллов соединений соединений In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>. использовали микрорентгеноспектральный и рентгеновский анализы.

В третьей главе мы исследовали свойства монокристаллов соединений In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

Результаты микрозондовых рентгеноспектральных измерений представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Данные микрозондового рентгеноспектрального анализа соединений In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

Образец	Fe, ат. %		In, ат. %		S, ат. %	
	эксп.	расч.	эксп.	расч.	эксп.	расч.
$In_2S_3$	_		39.75	40.00	60.25	60.00
FeIn <sub>2</sub> S <sub>4</sub>	14.10	14.29	28.27	28.57	57.68	57.14

Видно, что содержание компонент в выращенных монокристаллах  $In_2S_3$  и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> удовлетворительно согласуется с заданным составом в исходной шихте.

#### 3.2 Рентгеновский анализ

Дифрактограмма соединения In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> представлена на рисунке 3.1. Видно, что указанной дифрактограмме присутствуют индексы отражений, характерные для тетрагональной объемноцентрированной кристаллической решетки. Дифрактограмма соединения FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> приведена на рисунке 3.2. Видно, что указанной дифрактограмме присутствуют индексы отражений, характерные для кубической структуры шпинели.

Разрешение высокоугловых линий на указанных дифрактограммах свидетельствует о равновесности выращенных монокристаллов соединений In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

Углы отражения (2 $\theta$ ), межплоскостные расстояния (*d*), относительные интенсивности рефлексов (*I*/*I*<sub>0</sub>), индексы Миллера плоскостей (*hkl*) сведены в таблицы 3.2 и 3.3.



Рисунок 3.1. – Дифрактограмма соединения In<sub>2</sub>S<sub>3</sub>



Рисунок 3.2. – Дифрактограмма соединения FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>

По измеренным значениям углов дифракции, используя формулы (2.2 и 2.4), были рассчитаны параметры элементарной ячейки, которые равны:

для  $In_2S_3$ : a = 7, 618 ± 0,005 Å, c = 32,25 ± 0,05 Å; для  $FeIn_2S_4$ : a = 10,612 ± 0,005 Å.

Полученные нами значения параметров элементарной ячейки удовлетворительно согласуются с данными авторов для соединения  $In_2S_3$  [54, 55] и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> [56,57].

Результаты проведенных исследований приведены в виде частотных зависимостей величин ослабления и отражения ЭМИ в диапазоне 8–12 ГГц. На рисунке 3.3 показана частотная зависимость ослабления электромагнитного излучения (ЭМИ) кристаллами указанных соединений. Видно, что экраны электромагнитного излучения, созданные на основе соединения FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> обладают ослаблением порядка 12 дБ. Экраны ЭМИ, созданные на основе соединения In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> обладают ослаблением ~ 6 дБ.

На рисунке 3.4 представлены результаты исследования отражающих свойств экранов на основе соединений  $In_2S_3$  и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> в частотном диапазоне 8–12 ГГЦ. Коэффициент отражения для исследуемых образцов изменяется от -6 до -9 дБ (рисунок 3.4).

Анализ характеристик ослабления и отражения показывает, что указанные соединения обладают радиопоглощающими свойствами в исследуемом частотном диапазоне, что определяется приемлемым значением ослабления ЭМИ и невысоким значением коэффициента отражения.

Проведенные исследования показали, что порошки на основе соединений  $In_2S_3$  и FeIn\_2S\_4, обладают экранирующими свойствами и могут использоваться в качестве элементов экранов ЭМИ с возможностью формирования тонкопленочных покрытий толщиной до 1,0 мм с эффективностью ослабления уровня ЭМИ до 12 дБ в частотном диапазоне 8 – 12 ГГц. Сказанное позволяет предположить, что указанные соединения можно использовать для создания экранирующих средств, а также в целях обеспечения электромагнитной совместимости.

# 3.3 Исследование экранирующих характеристик элементов экранов ЭМИ на основе соединений In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>

Результаты проведенных исследований приведены в виде частотных зависимостей величин ослабления и отражения ЭМИ в диапазоне 8–12 ГГц. На рисунке 3.3 показана частотная зависимость ослабления электромагнитного излучения (ЭМИ) кристаллами указанных соединений. Видно, что экраны электромагнитного излучения, созданные на основе соединения FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> обладают ослаблением порядка 12 дБ. Экраны ЭМИ, созданные на основе соединения In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> обладают ослаблением ~ 6 дБ.

На рисунке 3.4 представлены результаты исследования отражающих свойств экранов на основе соединений  $In_2S_3$  и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> в частотном диапазоне 8–12 ГГЦ. Коэффициент отражения для исследуемых образцов изменяется от -6 до -9 дБ (рисунок 3.4).

Анализ характеристик ослабления и отражения показывает, что указанные соединения обладают радиопоглощающими свойствами в исследуемом частотном диапазоне, что определяется приемлемым значением ослабления ЭМИ и невысоким значением коэффициента отражения.

Проведенные исследования показали, что порошки на основе соединений  $In_2S_3$  и FeIn\_2S\_4, обладают экранирующими свойствами и могут использоваться в качестве элементов экранов ЭМИ с возможностью формирования тонкопленочных покрытий толщиной до 1,0 мм с эффективностью ослабления уровня ЭМИ до 12 дБ в частотном диапазоне 8 – 12 ГГц. Сказанное позволяет предположить, что указанные соединения можно использовать для создания экранирующих средств, а также в целях обеспечения электромагнитной совместимости.



Рисунок 3.3. – частотная зависимость ослабления электромагнитного

излучения



Рисунок 3.4. – Коэффициент отражения

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведенный литературный анализ кристаллической структуры соединений  $In_2S_3$  и  $FeIn_2S_4$  показал, что указанные соединения кристаллизуются в кубической структуре шпинели, причем параметры элементарной ячейки указанных соединений у разных авторов существенно отличаются между собой. Сказанное можно объяснить, вероятнее всего, различными методами синтеза и выращивания этих соединений.

2. Результаты исследований магнитных, оптических и электрических свойств свойств, приведенные различными авторами, значительно что свидетельствует о технологических отличаются друг от друга, трудностях В получении качественных монокристаллов указанных соединений.

3. Двухтемпературным методом (горизонтальный вариант) синтезированы поликристаллические слитки соединений In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

4. Разработаны температурные режимы выращивания монокристаллов направленной кристаллизацией расплава, (вертикальный вариант метода Бриджмена), позволяющие получать однородные монокристаллы соединений диаметром ~ 16 и длиной ~ 40 мм.

5. Для определения состава и кристаллической структуры выращенных монокристаллов соединений соединений In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>. использовали микрорентгеноспектральный и рентгеновский анализы.

6. Методом микрорентгеноспектрального анализа определен состав соединений  $In_2S_3$  и FeIn\_2S\_4. Показано, что содержание компонент в выращенных монокристаллах удовлетворительно согласуется с заданным составом в исходной шихте.

7. Рентгеновским методом определена структура и параметры элементарной ячейки. Установлено, что соединение In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> тетрагональной структуре шпинели, FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> – в кубической структуре шпинели.

8. На основе соединений In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и FeIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> созданы элементы экранов электромагнитного излучения и исследованы их свойства